

X線散乱によるナノ構造の解析

白澤 徹郎

(産業技術総合研究所)

放射光 X 線散乱を利用したナノ構造体の解析法について学びます。表面 X 線回折による結晶性ナノ薄膜の解析や、小角 X 線散乱を用いた非晶質ナノ粒子の解析などについてその基本原理や特徴を概観するとともに、最先端の応用例を紹介します。